

کریستالهای فوتونیکی یک بعدی فلز-دی الکتریک شفاف

ح.علی مددی^۱ ع.باناج^۲ م.حمیدی^۳ م.واعظ زاده^۱ م.نوربخش^۲ ف.پور حیدری^۱

^۱دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گروه فیزیک، سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده لیزر و اپتیک، ^۳دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده لیزر و پلاسما

چکیده - در این گزارش، به دلیل بالاتر بودن خواص اپتیکی غیر خطی فلزات نسبت به مواد دیگر و نیز پائین بودن ضریب عبور لایه های فلزی با ضخامت های بیشتر از عمق نفوذ، رفتار و چگونگی تولید کریستالهای فوتونیکی یک بعدی فلز-دی الکتریک با ضریب عبور بالا، مورد بررسی قرار گرفته است. در این نوع از مواد ترکیبی با خواص اپتیکی غیر خطی بالا، ضریب عبور از سازه Glass / $(Cu - MgF_2)^3 / Air$ در مقایسه با تک لایه ای از مس با ضخامتی معادل با مجموع لایه های مس در سازه بلورهای فوتونیکی، بیش از ۵۰٪ افزایش پیدا می کند که تطابق خوبی با نتایج حاصل از محاسبات تئوری بر اساس روش ماتریس انتقال^۱ دارد.

81.15.Ef Vacuum deposition

Transparent one dimensional metal-dielectric photonic crystal

alimadadi, h^۱;Bananej,a^۱; hamidi,m^۱; vaez zade,m^۱;norbakhsh,m^۱; heidar por,f^۱

¹Physics Department KNT University, tehran,Iran

²Laser and optics School, NSTRI,Tehran, Iran

³Laser and Plasma institute, Shahid Beheshti University, Tehran,Iran

Abstract

As we know metals have extremely large third order optical nonlinearity and fast response time and good candidate for all optical data processing. But being nontransmitting for optical radiation. . In this paper we propose a new kind of artificial materials composed of one dimensional metal-dielectric photonic crystal as Glass\($(Cu-MgF_2)^3 \backslash Air$ which the thicknesses of total metal(Cu) layers are more than three times of its skin depth. According to the numerical results, it can be seen that the transmission of the one dimensional photonic crystal increased 50% with respect to the metal layer with the same thickness. The experimental results have a good agreement with theory.

¹ Transfer Matrix Method

۱- مقدمه

Glass/(MD)³/Air نشانده‌نده فلز مس، Cu، و MgF₂ می‌باشد، با استفاده از تئوری ماتریس انتقال، می‌پردازیم. روش ماتریس بکار گرفته شده برای ضریب عبور نور تابشی در شدت‌های پایین قابل قبول است. بنا بر این در این روش اثرات غیر خطی اعمال نشده است و صرفاً رژیم خطی قابل قبول است. لازم به توضیح است که در این مقاله تأکید اصلی بر روی افزایش ضریب عبور در سازه فلز-دی الکتریک می‌باشد. اگر چه ضخامت کل فلز در سازه بیش از سه برابر ضخامت پوسته^۳ فلز می‌باشد. لازم به توضیح است به منظور بررسی اثرات غیر خطی از آزمایشات Z-scan با استفاده از لیزر هارمونیک Nd-Yag در حال انجام است. در قسمت تجربی به ساخت این ترکیب پرداخته ایم و نتایج به دست آمده بیانگر تطابقی مناسب بین نتایج تجربی و تئوری می‌باشد.

۲- کریستالهای فوتونیکی یک بعدی فلز-دی الکتریک

همانطور که می‌دانیم، امواج تابشی به لایه ای از فلز با ضخامت بیشتر از عمق پوسته (δ) کاملاً منعکس شده و درصد عبور از این لایه خیلی ناچیز می‌باشد. به طور کلی، در حالت تابش عمود، مقدار انرژی منعکس شده به صورت زیر محاسبه می‌گردد:

$$R = \frac{(1-n)^2 + k^2}{(1+n)^2 + k^2} \quad (1)$$

که در این رابطه، n و k قسمت حقیقی و موهومی ضریب شکست می‌باشند ($N = n + ik$). با استفاده از این رابطه و با توجه به مقادیر n و k برای مس (5) و عمق پوسته⁴ ($N_{Cu} = 0.261 + i3.64$)

Skin depth³

با توجه به بالا بودن خواص اپتیکی غیر خطی در فلزات (۱۰^۶ مرتبه بیش از سیلیکا) و نیز زمان واهلش در حد پیکوثانیه، می‌توان از فلزات در سیستمهای پردازشگر تمام نوری، محدود کننده‌های نوری^۲ و یا سونیچ‌های نوری سریع که بر اساس خاصیت اپتیک غیر خطی (Kerr effect) عمل می‌کنند، استفاده نمود (۱). فلزات خواص غیر خطی بالایی نسبت به دی الکتریک‌ها دارند که این خاصیت ذاتی فلز است، اما با توجه به ضریب تضعیف بسیار بالای فلزات در ضخامت‌های بیشتر از عمق نفوذ، در عمل استفاده از فلزات در ساخت المانهای فوتونیکی غیر ممکن می‌باشد (۲).

در طی سالهای اخیر، به منظور استفاده مطلوب از خواص اپتیکی غیر خطی فلزات بکارگیری از محلولهای کلوئیدی نانو ذرات فلزی و یا شیشه‌های آلائیده به نانو ذرات فلزی پیشنهاد شده اند که با توجه به خاصیت توده ای این نوع مواد استفاده از آنها در عمل مشکل است (۳ و ۴). امروزه بکار گیری از بلورهای فوتونیکی یک بعدی فلز-دی الکتریک به عنوان یک روش جایگزین توجه بسیاری از گروههای تحقیقاتی را جلب کرده است، که این ماده ترکیبی جدید با ضخامت فلزی چند عمق نفوذ در مقابل تابش‌های اپتیکی شفاف عمل می‌کند. کریستال فوتونیکی یک مفهوم کلی است و دارای انواع مختلف می‌باشد، کریستال فوتونیکی یک بعدی به محیط‌های اتلاق می‌شود که ثابت دی الکتریک به طور پریودیک در آن تغییر کند. سازه مورد بحث در این مقاله یکی از انواع کریستال فوتونیکی را شامل می‌شود. در این تحقیق، ابتدا به شبیه سازی رفتار اپتیکی (ضریب عبور) سازه

² Optical limiter

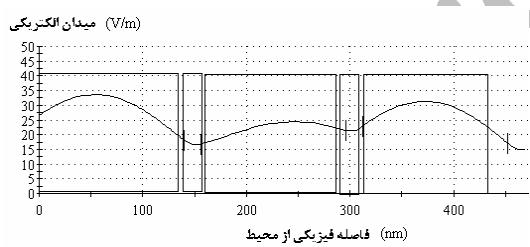
پشتیبانی پمپ مکانیکی به خلاء پایین رسیده است، روی زیرلایه شیشه انجام شده است.

با استفاده از تئوری ماتریس انتقال، به هر لایه فلز و دی الکتریک ماتریسی تحت عنوان ماتریس حالت

$$\text{به صورت} \begin{pmatrix} \cos \delta & \frac{i}{n} \sin \delta \\ i n \sin \delta & \cos \delta \end{pmatrix}$$

دهیم که در آن n ضریب شکست هر کدام از محیط‌ها و δ اختلاف فاز ایجاد شده در اثر گذر از محیط می‌باشد(۶). با ضرب کردن این ماتریس‌ها، متناسب با تعداد و خصوصیات لایه‌ها، درصد عبور و توزیع میدان الکتریکی این ساختار را به دست می‌آوریم.

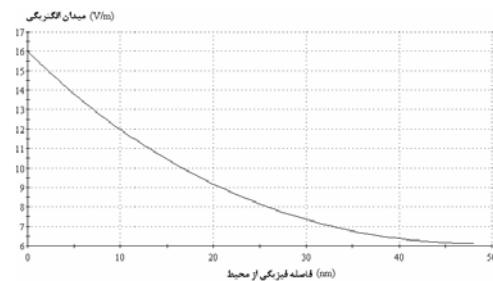
توزیع میدان الکتریکی در این ترکیب، در شکل ۲ مشاهده می‌شود که نشان دهنده افزایش میدان الکتریکی (انرژی تابشی) عبور کرده از بلور فوتونیکی، در مقایسه با لایه فلزی با ضخامت برابر با مجموع ضخامت لایه‌های فلزی در بلور است.



شکل ۲. توزیع میدان الکتریکی در بلور نوری فلز- دی الکتریک

همچنین با کمک گرفتن از این روش، نمودار انتقال لایه مس با ضخامت ۴۸ نانومتر محاسبه شده است که در شکل ۳(الف) قابل مشاهده است. با توجه به این نمودار، می‌توان این لایه را کدر در نظر گرفت. از طرفی نمودار انتقال ترکیب بلور فوتونیکی فلز- دی الکتریک مورد نظر نیز محاسبه و در شکل ۳(ب) نشان داده شده است.

$\delta = \lambda / 4\pi n = 13.1 nm$ در طول موج ۶۰۰ نانومتر، به ازای ضخامت‌های بیشتر از ۱۳ نانومتر، مقدار انرژی انعکاسی بیش از ۹۲٪ خواهد شد و این واقعیت را در شکل (۱) که نشان دهنده توزیع میدان الکتریکی در لایه ای از مس به ضخامت ۴۸ نانومتر است، نشان داده ایم.

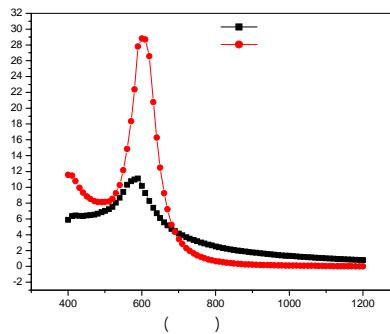


شکل ۱. توزیع میدان الکتریکی در ۴۸ نانومتر لایه مس به منظور حل این مشکل و توانایی استفاده از خواص غیر خطی اپتیکی فلز، از این ماده در ساختاری متناظر همراه با لایه‌های دی الکتریک، تحت عنوان بلورهای فوتونیکی فلز- دی الکتریک، استفاده می‌کنیم(4). به این صورت که کریستال نوری فلز- دی الکتریک را به صورت Glass / (MD)³ / Air میانگر لایه‌ی فلزی و D نشان دهنده لایه‌ی دی الکتریک است که به ترتیب از Cu و MgF₂ استفاده کرده‌ایم. ضخامت هر کدام از لایه‌های دی الکتریک با در نظر گرفتن عمق نفوذ امواج پلاسمونی در ترکیب فلز- دی الکتریک برابر با ۱۴۰ نانومتر و ضخامت لایه‌های مس، از مرتبه عمق نفوذ فلز (در طراحی ما ۱۶ نانومتر) در نظر گرفته شده است. مجموع ضخامت لایه‌های فلزی به کار رفته در این ترکیب، برابر با ضخامت تک لایه مس مورد بحث می‌باشد ($d \approx 3\delta$).

آماده سازی این لایه‌ها به روش تغییر حرارتی برای مس و تفنگ الکترونی برای MgF_2 ، در محیط خلاء 10^{-6} میلی بار که با استفاده از پمپ دیفیوژن و با

۳- منابع:

- [1] T.Tokizaki,A.Nakamara,S.Kaneko, K.Uchida,Appl.phys.lett65,941(1994)
- [2] S. Bennik, Y. Kwom, Yoon, . R. W. Boyd, Opt. lett, 24, 1416, (1999).
- [3] A.Schweinsberg,G.Piredda,R.S.Ben nik,R.W.boyd,phy,rev.lett.93,123902(2 004)
- [4] M.Scalora, M.J.Bloemer, J. Appl. Phys. Lett.72, 1676(1998).
- [5] E.D.Palik, "Hand book of optical constants of solids".
- (6) P. Yeh, "Optical waves in layered media", John willey and sons public. (2005).



شکل ۳. نمودار انتقال نمونه با استفاده از تئوری ماتریس انتقال.

(الف) با یک لایه مس (ب) نمودار انتقال نمونه فلز-دی

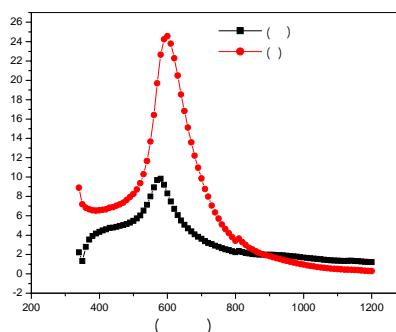
الکتریک با لایه های متناوب (Cu/MgF_2)

در تشابه با منحنی تغییرات میدان الکتریکی، انتقال

در نمونه ترکیبی مورد نظر ما به اندازه ۵۰ درصد

افزایش یافته است.

به منظور مقایسه نتایج تجربی و تئوری، در شکل ۴،
نمودار انتقال تک لایه مس و بلور تهیه شده آورده
شده است.



شکل ۴. (الف) نمودار انتقال نمونه با یک لایه مس (ب)

نمودار انتقال نمونه با لایه های متناوب (Cu/MgF_2)

با مقایسه شکل های ۳ و ۴، تطابق نتایج تئوری به

دست آمده و نتایج تجربی را می توان ملاحظه کرد و

در نتیجه با مشاهده افزایش ۵۰ درصدی در انتقال از

بلور فوتونیکی فلز-دی الکتریک

 $\text{Glass}/(\text{Cu}-\text{MgF}_2)^3/\text{Air}$

اپتیکی غیر خطی فلز مس در طول موج ۶۰۰ نانومتر

به راحتی استفاده نمود.